Docket No.: 60188-638 PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277

Kazuko NISHIMURA, et al. : Confirmation Number:

Serial No.: : Group Art Unit:

Filed: August 27, 2003 : Examiner:

For: LASER DIODE DRIVER WITH EXTINCTION RATIO CONTROL

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop CPD Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claims the priority of:

Japanese Patent Application No. JP2002-257860, filed on September 3, 2002.

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Michael E. Fogarty Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 MEF:gav Facsimile: (202) 756-8087 **Date: August 27, 2003**

60188-638 Kazuko Nishimura, eta:

日本 国 特 許 庁 August 28, 2003 JAPAN PATENT OFFICE McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月 3日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-257860

[ST.10/C]:

[JP2002-257860]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 4月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 2037640014

【提出日】 平成14年 9月 3日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01S 5/068

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株

式会社内

【氏名】 西村 佳壽子

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株

式会社内

【氏名】 木村 博

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】 100110939

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 宏

【選任した代理人】

【識別番号】 100110940

【弁理士】

【氏名又は名称】 嶋田 高久

【選任した代理人】

【識別番号】 100113262

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 祐二

【選任した代理人】

【識別番号】 100115059

【弁理士】

【氏名又は名称】 今江 克実

【選任した代理人】

【識別番号】 100115510

【弁理士】

【氏名又は名称】 手島 勝

【選任した代理人】

【識別番号】 100115691

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤田 篤史

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0006010

・ 【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 消光比補償レーザ駆動回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光回路と、

前記発光回路を駆動するための駆動回路と、

前記駆動回路から出力されるパルス電流にバイアス電流を付加するためのバイアス回路と、

前記発光回路の出力するモニタ光を受光するための受光回路と、

前記受光回路の出力を電流ー電圧変換するためのI/V変換回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧の最大値を検出するための最大値検出回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧の平均値を検出するための平均値検出回路と、

前記最大値と第1の基準値とを比較し、結果を前記駆動回路へ帰還するための 第1の比較回路と、

前記平均値と第2の基準値とを比較し、結果を前記バイアス回路へ帰還するための第2の比較回路とを備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項2】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記第2の基準値は前記第1の基準値から生成されることを特徴とするレーザ 駆動回路。

【請求項3】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記第2の基準値は前記最大値検出回路で検出した最大値から生成されること を特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項4】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記バイアス回路の最適な初期バイアス値を自動設定するための初期バイアス 決定回路を更に備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項5】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記最大値検出回路で検出した最大値と前記第1の基準値との差が大きい場合には、前記パルス電流を急激に増減するためのアダプティブ駆動回路を更に備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項6】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記平均値検出回路で検出した平均値と前記第2の基準値との差が大きい場合には、前記バイアス電流を急激に増減するためのアダプティブバイアス回路を更に備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項7】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記発光回路の駆動電流の最大値を検出するための最大値検出回路と、

前記発光回路の駆動電流の平均値を検出するための平均値検出回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧の最大値が前記第1の基準値より大きい場合には前記第1の比較回路から信号を受け、前記2つの最大値と2つの平均値より閾値電流を求める演算を行い、前記バイアス回路へ帰還を行うための閾値電流検出回路とを更に備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項8】 請求項7記載のレーザ駆動回路において、

前記閾値電流検出回路における検出精度を向上させるように、前記受光回路の 出力電流を増幅するための増幅回路を更に備えたことを特徴とするレーザ駆動回 路。

【請求項9】 請求項1記載のレーザ駆動回路において、

前記I/V変換回路の出力電圧の立ち上がりを検出するための第1の立ち上がり検出回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧の立ち下がりを検出するための第1の立ち下がり検出回路と、

前記出力電圧の立ち上がりと立ち下がりとの時間差を演算するための第1の演 算回路と、

前記発光回路の駆動電流の立ち上がりを検出するための第2の立ち上がり検出 回路と、

前記発光回路の駆動電流の立ち下がりを検出するための第2の立ち下がり検出 回路と、

前記駆動電流の立ち上がりと立ち下がりとの時間差を演算するための第2の演 算回路と、

前記第1の演算回路の出力と前記第2の演算回路の出力とを比較し、結果を前 記バイアス回路へ帰還するための第3の比較回路とを更に備えたことを特徴とす るレーザ駆動回路。

【請求項10】 発光回路と、

前記発光回路を駆動するための駆動回路と、

前記駆動回路から出力されるパルス電流にバイアス電流を付加するためのバイアス回路と、

前記発光回路の出力するモニタ光を受光するための受光回路と、

前記受光回路の出力を電流ー電圧変換するためのI/V変換回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧の最大値を検出するための最大値検出回路と、

前記I/V変換回路の出力電圧のデューティ比を検出し、前記バイアス回路へ 帰還するためのデューティ検出回路と、

前記最大値と第1の基準値とを比較し、結果を前記駆動回路へ帰還するための 比較回路とを備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項11】 請求項10記載のレーザ駆動回路において、

前記デューティ検出回路は、前記I/V変換回路の出力電圧を受け取るチャージポンプ回路を備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項12】 請求項10記載のレーザ駆動回路において、

前記デューティ検出回路は、

前記I/V変換回路の正相及び逆相の出力電圧の平均値をそれぞれ検出するための2つの平均値検出回路と、

前記両平均値検出回路の出力を比較し、結果を前記バイアス回路へ帰還するための比較回路とを備えたことを特徴とするレーザ駆動回路。

【請求項13】 請求項12記載のレーザ駆動回路において、

前記両平均値検出回路は、それぞれローパスフィルタ回路で構成されたことを 特徴とするレーザ駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、消光比補償機能を備えたAPC (Automatic Power Control) 方式 レーザ駆動回路に関するものである。 [0002]

【従来の技術】

光通信分野において、レーザダイオード(LD)からなる発光回路と、フォトダイオード(PD)からなる受光回路とを備えたレーザモジュールが知られている。発光回路のLDは、入力データに応じたパルス電流にバイアス電流が加えられて所定の光出力を行う一方、APC用のモニタ光を出力する。受光回路のPDは、LDの出力したモニタ光を受光し、光ー電流変換を行う。この変換により得られた電流に基づいて、一定の光出力及び消光比が得られるようにPDのバイアス電流及びパルス電流の大きさが制御される。

[0003]

周知のように、温度変動、プロセス変動、長期間使用による劣化等に起因して、LDの閾値電流及び変換効率に変動が生じる。また、LD特性はメーカー、種類によって、閾値電流、変換効率、それらの温度による変動量等が全く異なる。 LD-PDの結合効率も様々である。そこで、常に一定の光出力及び消光比を得るためには、バイアス電流及びパルス電流の大きさを適切に初期化し、かつ使用状態に応じて常に最適化する必要がある。

[0004]

ここで、温度変動に起因したLDの閾値電流及び変換効率の変動について、図 1~図3を用いて説明する。

[0005]

図1は、低温(T1)、常温(T2)及び高温(T3)のうち、常温(T2)時における従来のLD駆動例を実線の電流-光変換特性(I-P特性)12で示したものである。ここに、IはLDへの注入電流(駆動電流)であり、Pは当該LDの光出力であり、I-P特性の傾きが変換効率を表している。常温時の当該LDの閾値電流はIth2であり、バイアス電流Ibが閾値電流Ith2と等しくなるように設定され(Ib=Ith2)、入力データに従ったパルス電流Ipがバイアス電流Ibに重畳される。ここで、1:1のデューティ比(High期間:Low期間)を持つパルス電流Ipが当該LDに与えられると、図示のような所望の高い消光比(Pmax/Pmin)を示し、かつ1:1のデューティ比を示す最大光出

力Pmax及び最小光出力Pminが得られる。

[0006]

図2は、高温(T3)時における従来のLD駆動例を実線のI-P特性13で示したものである。高温時において、LDの閾値電流はIth3(>Ith2)へと変化し、かつ変換効率は常温時に比べて低くなる。ところが、依然として常温(T2)時と同じバイアス電流Ib(=Ith2)及びパルス電流Ipが当該LDに与えられる場合には、図示の最大光出力Pmax3及び最小光出力Pmin3のように、光出力Pの最大値が小さくなってしまい、消光比が劣化する。しかも、光出力Pのデューティ比が大幅に劣化してしまう。

[0007]

図3は、低温(T1)時における従来のLD駆動例を実線のI-P特性11で示したものである。低温時において、LDの閾値電流はIth1(>Ith2)へと変化し、かつ変換効率は常温時に比べて高くなる。ところが、依然として常温(T2)時と同じバイアス電流Ib(=Ith2)及びパルス電流Ipが当該LDに与えられる場合には、図示の最大光出力Pmax1及び最小光出力Pmin1のように、光出力Pの最大値、最小値ともに大きくなってしまい、やはり消光比が劣化する。

[0008]

以上のとおり、図2のようにバイアス電流Ibが閾値電流Ith3を下回った場合には最大光出力、消光比及びデューティ比が急激に劣化し、また図3のようにバイアス電流Ibが閾値電流Ith1を上回った場合には消光比が大幅に劣化し、いずれも通信に支障をきたすといった問題が生じる。

[0009]

図4は、周囲温度によらず一定の最大光出力、消光比及びデューティ比が得られる理想的なLD駆動例を示している。すなわち、高温(T3)時には、閾値電流のIth2からIth3への増大に対応してバイアス電流をIb3(\approx Ith3)へと増大させ、かつ変換効率の減少に対応してパルス電流をIp3へと増大させる。また、低温(T1)時には、閾値電流のIth2からIth1への減少に対応してバイアス電流をIb1(\approx Ith1)へと減少させ、かつ変換効率の増大に対応してパルス電流をIp1へと減少させるのである。これにより、周囲温度によらず、常温(T2

)時と同じ最大光出力Pmax及び最小光出力Pminが常に得られることとなる。

[0010]

このような理想的なLD駆動を実現するため、様々な試みがなされてきた。そのうちの1つの従来技術は、LDが出力するモニタ光をPDが光一電気変換して出力する電気信号を平均値検出回路及び尖頭値検出回路に入力し、両検出回路が出力した平均値出力電圧及び尖頭値出力電圧を演算回路に印加し、該演算回路にて平均値出力電圧の2倍の電圧と尖頭値出力電圧との差に比例する電圧を生成し、該生成した電圧をレーザ駆動回路の参照電圧設定端子又はバイアス電流制御端子へ帰還するとともに、平均値出力電圧をパルス電流制御端子へ帰還する構成をとることによって、光出力波形の振幅、上下対称性及び消光比を安定化するものである(特許文献1)。

[0011]

【特許文献1】

特開平6-164049号公報

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術では、平均光出力は一定になるものの、最小光出力が0に等しい ものと仮定して平均値出力電圧の2倍の電圧と尖頭値出力電圧との差が0になる ように制御を行っているため、実際には存在する最小光出力(≠0)の大きさ分 のオフセットの影響が出るという問題がある。

[0013]

また、上記従来技術では、バイアス電流が閾値電流を上回る場合に、平均光出力が基準値と等しいものの、光出力のデューティ比が1:1でなく、かつ平均値出力電圧の2倍の電圧と尖頭値出力電圧との差が0の状態で平衡状態となってしまう可能性があり、所望の最大光出力、消光比及びデューティ比が得られない場合が生じる。

[0014]

本発明の目的は、温度変動、プロセス変動、長期間使用による劣化等に起因してLDの閾値電流及び変換効率に変動が生じた場合にも、当該LDに与えるバイ

アス電流及びパルス電流を最適化することで、最大光出力、消光比及びデューティ イ比を常に一定に制御できるレーザ駆動回路を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明に係る第1の消光比補償レーザ駆動回路は、発光回路と、該発光回路を駆動するための駆動回路と、該駆動回路から出力されるパルス電流にバイアス電流を付加するためのバイアス回路と、前記発光回路の出力するモニタ光を受光するための受光回路と、該受光回路の出力を電流一電圧変換するためのI/V変換回路と、該I/V変換回路の出力電圧の最大値を検出するための最大値検出回路と、前記I/V変換回路の出力電圧の平均値を検出するための平均値検出回路と、前記最大値と第1の基準値とを比較して結果を前記駆動回路へ帰還するための第1の比較回路と、前記平均値と第2の基準値とを比較して結果を前記バイアス回路へ帰還するための第2の比較回路とを備えた構成を採用したものである。

[0016]

また、本発明に係る第2の消光比補償レーザ駆動回路は、発光回路と、該発光回路を駆動するための駆動回路と、該駆動回路から出力されるパルス電流にバイアス電流を付加するためのバイアス回路と、前記発光回路の出力するモニタ光を受光するための受光回路と、該受光回路の出力を電流一電圧変換するためのエノV変換回路と、該エノV変換回路の出力電圧の最大値を検出するための最大値検出回路と、前記エノV変換回路の出力電圧のデューティ比を検出して前記バイアス回路へ帰還するためのデューティ検出回路と、前記最大値と第1の基準値とを比較して結果を前記駆動回路へ帰還するための比較回路とを備えた構成を採用したものである。

[0017]

【発明の実施の形態】

図5は、本発明の第1の実施形態に係る消光比補償レーザ駆動回路のブロック 図である。図5において、21はレーザモジュールであって、所定の光出力を行 う一方、APC用のモニタ光を出力するように電流-光変換を行うレーザダイオ ード(LD)からなる発光回路21 aと、この発光回路21 aの出力するモニタ 光を受光するためのフォトダイオード(PD)からなる受光回路21 bとで構成 されている。22はLD駆動回路、23はバイアス回路、24はI/V変換回路 、25は最大値検出回路、26は平均値検出回路、27は第1の比較回路、28 は基準値作成回路、29は第2の比較回路である。

[0018]

LD駆動回路22は、入力データ(DATA)に応じて発光回路21 aを駆動するようにパルス電流Ipを供給する。バイアス回路23は、LD駆動回路22から出力されるパルス電流Ipにバイアス電流Ibを付加する。つまり、発光回路21 aへの注入電流(駆動電流)IはIb+Ipに等しい。I/V変換回路24は、受光回路21bの出力を電流一電圧変換する。最大値検出回路25は、I/V変換回路24の出力電圧の最大値Vmaxを検出する。平均値検出回路26は、I/V変換回路24の出力電圧の平均値Vaveを検出する。第1の比較回路27は、最大値検出回路25の出力した最大値Vmaxと予め設定した第1の基準値(第1の基準電圧)Vref1とを比較し、その差が0になるように比較結果をLD駆動回路22へ帰還することで、パルス電流Ipをチャージ、ディスチャージする。基準値作成回路28は、第1の基準値Vref1から第2の基準値(第2の基準電圧)Vref2を生成する。第2の比較回路29は、平均値検出回路26の出力した平均値Vaveと第2の基準値Vref2とを比較し、その差が0になるように比較結果をバイアス回路23へ帰還することで、バイアス電流Ibをチャージ、ディスチャージする。

[0019]

図5の構成によれば、最大値Vmaxを基準値Vref1と一致させることによって、LDの閾値電流や変換効率が大きくなった場合にも、小さくなった場合にも、図4に示したように最大光出力Pmaxを一定に保ち、かつ2つの帰還ループで最大値Vmax、平均値Vaveをそれぞれ基準値Vref1、Vref2と一致させることによって、図4に示したように、消光比及びデューティ比を常に一定に保つことができる。また、図5の構成では入力データ(DATA)のデューティ比は変更しないので、LDの変換効率が大幅に変動した場合でも光出力のデューティ比が劣化

しにくい。

[0020]

図6は、図5中の基準値作成回路28の構成例を示している。つまり、第2の基準値Vref2の具体的な生成手法を示す。消光比を常に一定に保つためには、I/V変換回路24の出力電圧の最大値をVmax、最小値をVminとした場合に、VmaxとVminとの比を一定に保てばよい。そのため、上記のようにVmaxをVref1に一致させる場合には、VminはVmaxから決定され、VaveはVmax及びVminの中間値に決定される。ゆえに、「Vmax:Vmin=R+r:r=一定」と定義でき、平均値Vaveの基準値、すなわち第2の基準値Vref2はVmax×{(R/2)+r}/(R+r)と抵抗分割することによって設定できる。なお、基準値生成ができる方法であれば、抵抗分割以外のどのような方法でも構わない。

[0021]

第2の基準値Vref2は、図5において基準値作成回路28に入る第1の基準値Vref1の実線矢印で示したように第1の基準値Vref1を基準に作成してもよいし、図5において最大値検出回路25から基準値作成回路28に至る破線矢印で示したように、検出した最大値Vmaxを基準に作成してもよい。ただし、最大値Vmaxの帰還と平均値Vaveの帰還とを同時に行った場合には平衡状態になるまでに長い収束時間がかかってしまうため、予め設定した第1の基準値Vref1から第2の基準値Vref2を作成した方がよい。最大値Vmax、平均値Vaveともに固定された第1の基準値Vref1に対しての最適化となり、収束時間の高速化が見込まれる

[0022]

図7は、図5の構成の第1の変形例を示している。図7のレーザ駆動回路は、初期バイアス決定回路31を図5の構成に付加したものである。初期バイアス決定回路31は、初期状態に応じたバイアス回路23の最適な初期バイアス値を自動設定する。具体的には、発光回路21aに任意の3点の電流 $Ib-\alpha$ 、Ib、 $Ib+\alpha$ を入力し、各々の場合の受光回路21bの出力電流を初期バイアス決定回路31がモニタする。I-P特性(例えば図1中の特性12)には折れ曲がり点があるので、バイアス電流値を連続的に変化させ、 $Ib-\alpha$ の場合の出力電流

と I b の場合の出力電流との変化量(第 1 の変化量)と、 I b の場合の出力電流 と I b + α の場合の出力電流との変化量(第 2 の変化量)とを検出し、第 1 の変 化量と第 2 の変化量とが異なった場合には、このときの電流を L D の 関値電流 I thとほぼ等しい電流と認識し、これを初期のバイアス電流 I b として設定する。 これにより、初期のバイアス電流 I b を 関値電流 I thとほぼ等しくすることができる。 したがって、各々の L D にあった初期バイアス電流設定が自動でできるようになり、検査工程の簡易化、製品の低コスト化を実現できる。

[0023]

なお、 α は小さい値にすればするほど、精度の良い初期バイアス電流 I b の設定が可能となる。また、入力点は 3 点でも、それ以上でも構わないし、 2 点以上の入力点から演算で求めても構わない。 閾値電流 I thが求まる手法であればどのような方法でも構わない。また、発光回路 2 1 a に任意の 3 点の電流 I b $-\alpha$ 、I b、I b $+\alpha$ を入力し、受光回路 2 1 b の出力をモニタするのだが、モニタする信号は受光回路 2 1 b の出力電流でも、 I / V 変換回路 2 4 の出力電圧でも構わない。

[0024]

図8は、図5の構成の第2の変形例を示している。図8のレーザ駆動回路は、アダプティブ駆動回路32と、アダプティブバイアス回路33とを図5の構成に付加したものである。初期設定時や、周辺温度が急激に変化した場合や、LD及び各構成素子の劣化が進んだ場合には、LDの閾値電流や変換効率が急激に変化することがある。このような場合に、図5の構成でも最適化を行うことは可能であるが最適値に収束するまでに時間がかかってしまう。そこで、ある一定量以上の変化が起こった場合には、第1の比較回路27から急激な変化が起こったという信号を出力し、それを受けたアダプティブ駆動回路32は、パルス電流IPを急激にチャージ、ディスチャージするようLD駆動回路22に働きかける。また、第2の比較回路29から急激な変化が起こったという信号を出力し、それを受けたアダプティブバイアス回路33は、バイアス電流Ibを急激にチャージ、ディスチャージするようバイアス回路33は、バイアス電流Ibを急激にチャージ、ディスチャージするようバイアス回路23に働きかけるのである。以上のように、図8の構成を採用することによって、LD特性の急激な変化時にも高精度でかつ

高速な最適化が可能となる。なお、アダプティブ回路32,33は両方同時に使ってもよいし、片方のみ使っても構わない。

[0025]

図9は、図5の構成の第3の変形例を示している。図9のレーザ駆動回路は、LD駆動電流の最大値Imaxを検出するための最大値検出回路41と、LD駆動電流の平均値Iaveを検出するための平均値検出回路42とに加えて、閾値電流検出回路43と、増幅回路44とを図5の構成に付加したものである。閾値電流検出回路43は、I/V変換回路24の出力電圧の最大値Vmaxが第1の基準値Vref1より大きい場合には第1の比較回路27から信号を受け、2つの最大値Vmax, Imaxと2つの平均値Vave, Iaveより閾値電流Ithを求める演算を行い、バイアス回路23へ帰還を行う。この閾値電流検出回路43における検出精度を向上させるために、受光回路21bの出力電流が小さい場合には、増幅回路44は当該出力電流を増幅する。

[0026]

周辺温度が低温になった場合等、閾値電流Ithが小さく、かつ変換効率が大きくなった場合には、受光回路21bの出力電流のデューティ比は1:1のままで最大光出力Pmax及び最小光出力Pminがともに大きくなる結果、消光比が劣化する(図3参照)。このような場合、最大値検出回路25でVmaxを第1の基準値Vref1に合わせるとともに、VmaxとImaxとの関係と、VaveとIaveとの関係との2点から閾値電流検出回路43で閾値電流Ithを演算し、その閾値電流Ithをバイアス回路23のバイアス電流Ibへ帰還することによって、より高速に最適値に収束させることができる。LDへの注入電流(駆動電流)Iが閾値電流Ith以上の場合にはIーP特性が一次式で近似できるので、IーP特性上の2点から閾値電流Ithを求めるものとする。図9の構成を採用することによって、図5の構成に比べてより高速にバイアス電流Ibを最適化することが可能となる。なお、閾値電流Ithの演算方法では上記のように一次式で近似してもよいし、二次以上の多次式で近似しても構わないし、その他のどのような演算方法をとっても構わない。

[0027]

図10は、図5の構成の第4の変形例を示している。図10のレーザ駆動回路は、I/V変換回路24の出力電圧の立ち上がりを検出するための立ち上がり検出回路51と、I/V変換回路24の出力電圧の立ち下がりを検出するための立ち下がり検出回路52と、これら出力電圧の立ち上がりと立ち下がりとの時間差を演算するための第1の演算回路53と、LD駆動電流Iの立ち上がりを検出するための立ち上がり検出回路54と、LD駆動電流Iの立ち下がりを検出するための立ち下がり検出回路55と、これらLD駆動電流Iの立ち上がりと立ち下がりとの時間差を演算するための第2の演算回路56と、第1の演算回路53の出力と第2の演算回路56の出力とを比較してその結果をバイアス回路23へ帰還することで、デューティ比の一定な光出力が得られるようにバイアス回路23を制御するための第3の比較回路57とを図5の構成に付加したものである。

[0028]

図10の構成では、発光回路21aの入力電流及び受光回路21bの出力電流の各々の立ち上がりと立ち下がりとを検出し、立ち上がりから立ち下がりまでの時間を演算する。これらの演算で得られた時間をバイアス回路23へ帰還することによって、デューティ比の一定な光出力を得ることが可能となる。また、図10の構成を用いることによって、デューティ比の劣化が生じた場合には2重の帰還がかかることになり、図5の構成に比べてより高速に最適値に収束させることが可能となる。なお、立ち上がりと立ち下がりの検出は高精度なラッチ回路を用いても構わないし、ソフト等で処理しても構わないし、時間を検出できる構成であればどのような構成でも構わない。

[0029]

図11は、本発明の第2の実施形態に係る消光比補償レーザ駆動回路のブロック図である。図11において、21はレーザモジュールであって、所定の光出力を行う一方、APC用のモニタ光を出力するように電流一光変換を行うレーザダイオード(LD)からなる発光回路21aと、この発光回路21aの出力するモニタ光を受光するためのフォトダイオード(PD)からなる受光回路21bとで構成されている。22はLD駆動回路、23はバイアス回路、24はI/V変換回路、25は最大値検出回路、27は比較回路、61はデューティ検出回路であ

る。デューティ検出回路 6 1 は、基準値作成回路 6 2 と、チャージポンプ回路 6 3 とで構成される。

[0030]

LD駆動回路22は、入力データ(DATA)に応じて発光回路21aを駆動するようにパルス電流Ipを供給する。バイアス回路23は、LD駆動回路22から出力されるパルス電流Ipにバイアス電流Ibを付加する。つまり、発光回路21aへの注入電流(駆動電流)IはIb+Ipに等しい。I/V変換回路24は、受光回路21bの出力を電流一電圧変換する。最大値検出回路25は、I/V変換回路24の出力電圧の最大値Vmaxを検出する。比較回路27は、最大値検出回路25の出力した最大値Vmaxを検出する。比較回路27は、最大値検出回路25の出力した最大値Vmaxと予め設定した第1の基準値(第1の基準電圧)Vref1とを比較し、その差が0になるように比較結果をLD駆動回路22へ帰還することで、パルス電流Ipをチャージ、ディスチャージする。

[0031]

デューティ検出回路 6 1 は、I / V変換回路 2 4 の出力電圧のデューティ比を 検出し、バイアス回路 2 3 へ帰還する。図 1 1 の構成では、I / V変換回路 2 4 の出力電圧のHigh期間、Low期間に応じてチャージポンプ回路 6 3 の入力 電圧値が上下し、その電圧変動をバイアス回路 2 3 へ帰還することによって、最 終的には光出力のデューティ比が一定値に収束する特性を利用している。Hig h期間、Low期間の閾値には、基準値作成回路 6 2 で V ref 1 から基準値(基準 電圧) V ref 3 を作成して用いる。

[0032]

本実施形態では、デューティ検出回路 6 1 において検出したデューティ比が 1 : 1 でなければ、その比に応じてバイアス回路 2 3 へ帰還を行う。つまり、図 2 に示したように高温時には L o w期間の比率が高くなるので、高温時にはバイアス電流 I b を増加させることで、光出力のデューティ比が 1 : 1 になるように制御する。

[0033]

以上のように、図11の構成を採用することによって、図5の場合に比べて簡 易な構成で、最大光出力、消光比及びデューティ比を常に一定にすることが可能 となる。なお、デューティ比の検出はA/D変換回路を用いても構わないし、ローパスフィルタ(LPF)回路を用いても構わないし、デューティ比の検出ができる構成であればどのような回路構成を用いても構わない。

[0034]

図12は、図11の構成の1つの変形例を示している。図12のレーザ駆動回路では、デューティ検出回路61が2つの平均値検出回路64,66と、反転回路65と、比較回路67とで構成される。一方の平均値検出回路64はI/V変換回路24の正相の出力電圧の平均値を、他方の平均値検出回路66はI/V変換回路24の逆相の出力電圧の平均値をそれぞれ検出する。比較回路67は、両平均値検出回路64,66の出力を比較し、結果をバイアス回路23へ帰還する。この構成では、デューティ比が1:1であれば、正相の出力電圧の平均値と逆相の出力電圧の平均値とが等しくなることを利用している。両平均値検出回路64,66はLPF回路を用いることによって容易に構成することができる。なお、平均値を検出できる構成であればどのような回路構成を用いても構わない。

[0035]

【発明の効果】

以上説明してきたように、本発明によれば、温度変動、プロセス変動、長期間使用による劣化等に起因してLDの閾値電流及び変換効率に変動が生じた場合にも、当該LDに与えるバイアス電流及びパルス電流を最適化することで、最大光出力、消光比及びデューティ比を常に一定に制御できるレーザ駆動回路を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

常温時における従来のレーザダイオード駆動例を示す特性図である。

【図2】

髙温時における従来のレーザダイオード駆動例を示す特性図である。

【図3】

低温時における従来のレーザダイオード駆動例を示す特性図である。

【図4】

周囲温度によらず一定の最大光出力、消光比及びデューティ比が得られる理想的なレーザダイオード駆動例を示す特性図である。

【図5】

本発明の第1の実施形態に係るレーザ駆動回路のブロック図である。

【図6】

図5中の基準値作成回路の構成例を示す回路図である。

【図7】

図5の構成の第1の変形例を示すブロック図である。

【図8】

図5の構成の第2の変形例を示すブロック図である。

【図9】

図5の構成の第3の変形例を示すブロック図である。

【図10】

図5の構成の第4の変形例を示すブロック図である。

【図11】

本発明の第2の実施形態に係るレーザ駆動回路のブロック図である。

【図12】

図11の構成の1つの変形例を示すブロック図である。

【符号の説明】

- 11,12,13 電流-光変換特性
- 21 レーザモジュール
- 21a 発光回路 (レーザダイオード:LD)
- 21b 受光回路 (フォトダイオード: PD)
- 22 LD駆動回路
- 23 バイアス回路
- 24 I/V変換回路
- 25 最大値検出回路
- 26 平均值検出回路
- 27, 29 比較回路

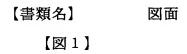
- 28 基準値作成回路
- 31 初期バイアス決定回路
- 32 アダプティブ駆動回路
- 33 アダプティブバイアス回路
- 4 1 最大値検出回路
- 4 2 平均值検出回路
- 4 3 閾値電流検出回路
- 44 増幅回路
- 51,54 立ち上がり検出回路
- 52,55 立ち下がり検出回路
- 53,56 演算回路
- 57 比較回路
- 61 デューティ検出回路
- 62 基準値作成回路
- 63 チャージポンプ回路
- 64,66 平均值検出回路
- 65 反転回路
- 67 比較回路
- DATA 入力データ
- I 注入電流(駆動電流)
- I ave 平均值(平均電流)
- Ib, Ib1, Ib3 バイアス電流
- I max 最大値(最大電流)
- Ip, Ipl, Ip3 パルス電流
- I th1, I th2, I th3 閾値電流
- P 光出力
- Pmax, Pmax1, Pmax3 最大光出力
- Pmin, Pmin1, Pmin3 最小光出力
- T1, T2, T3 温度

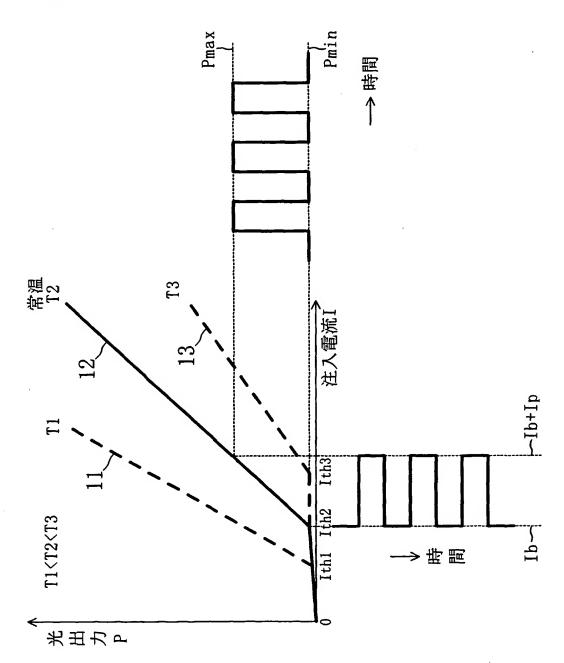
特2002-257860

Vave 平均值(平均電圧)

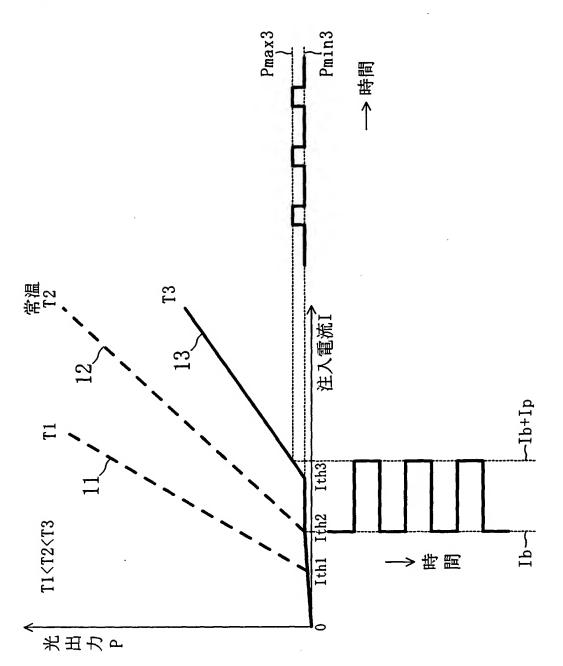
V max 最大値(最大電圧)

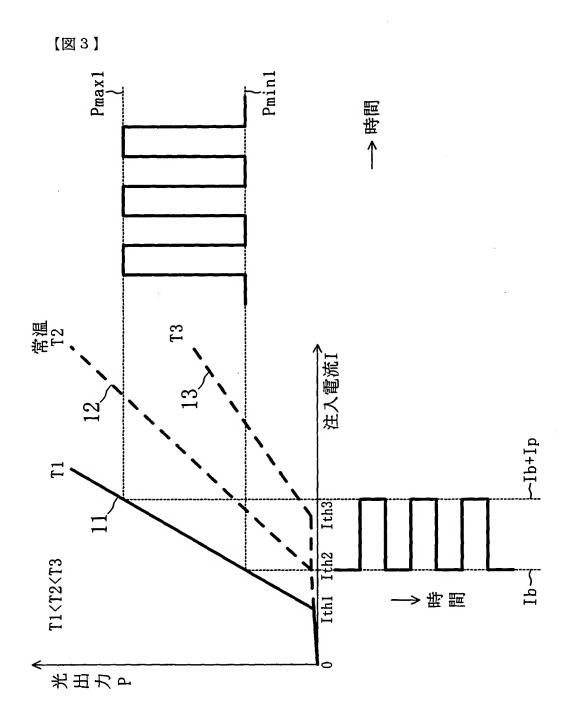
Vref1, Vref2, Vref3 基準値(基準電圧)



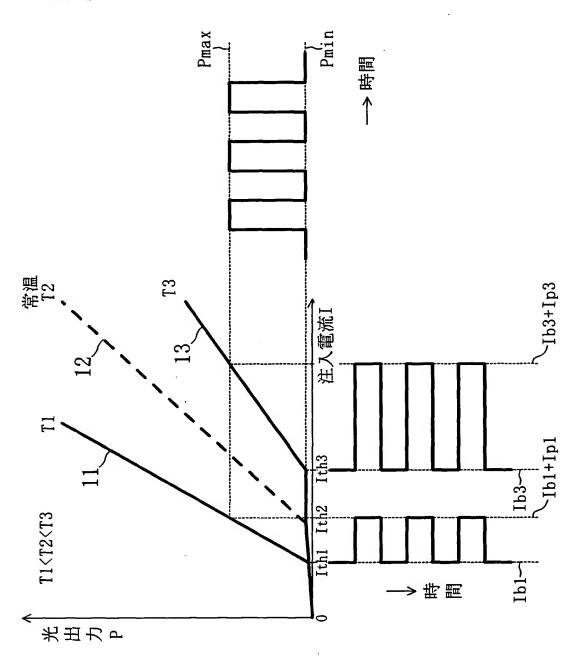




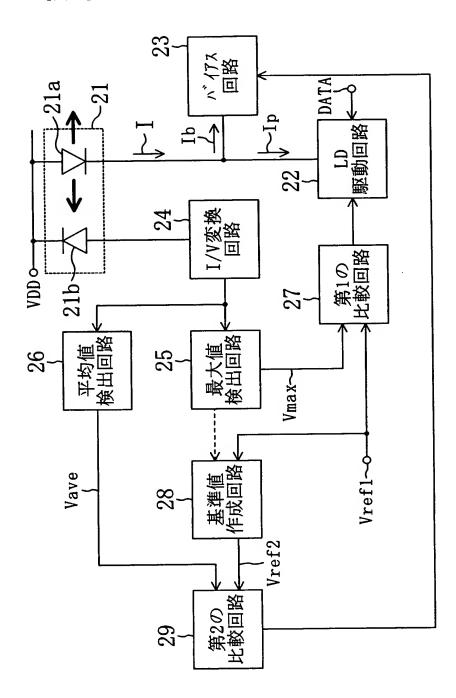






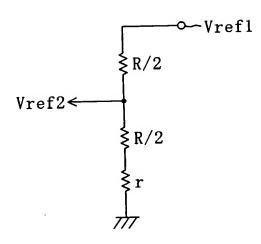


【図5】

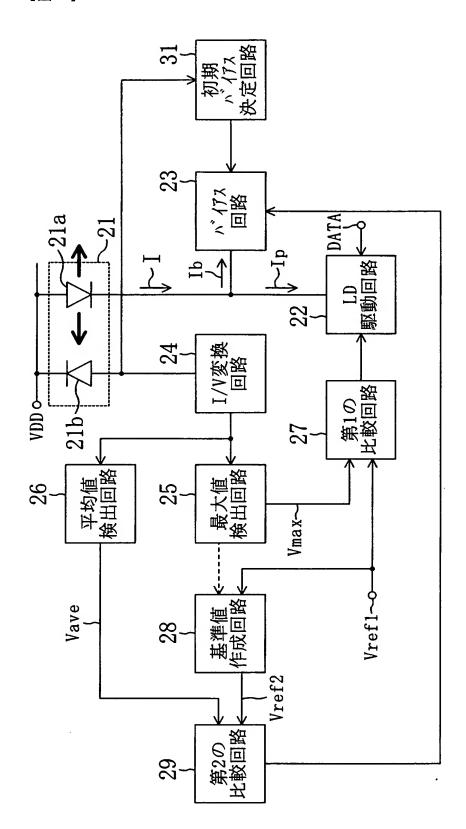


【図6】

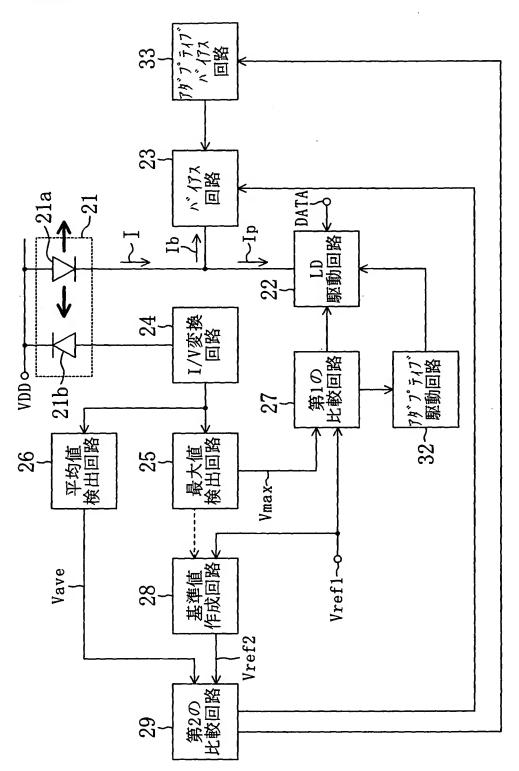
<u>28</u>



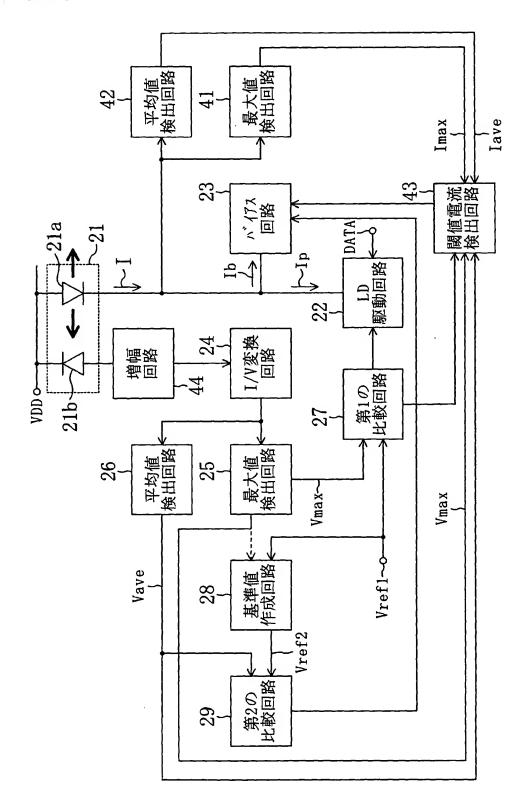
【図7】



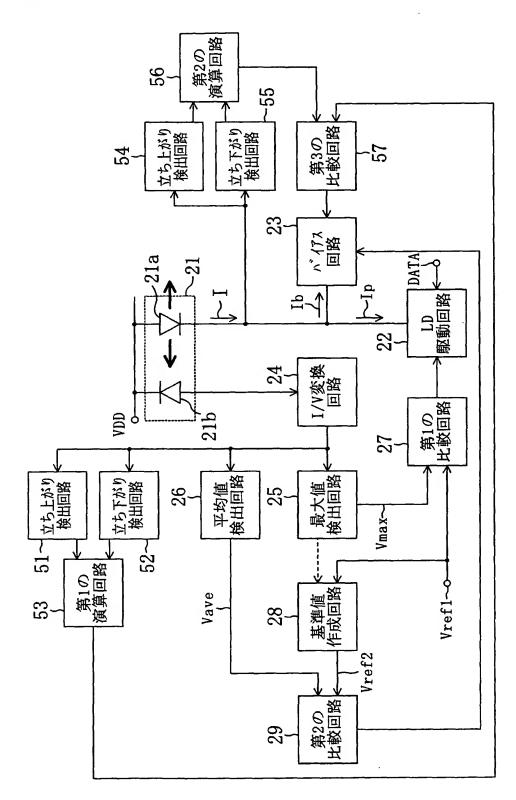
【図8】



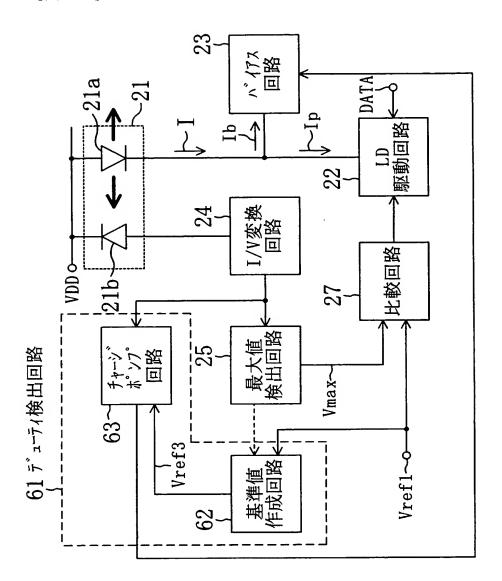
【図9】



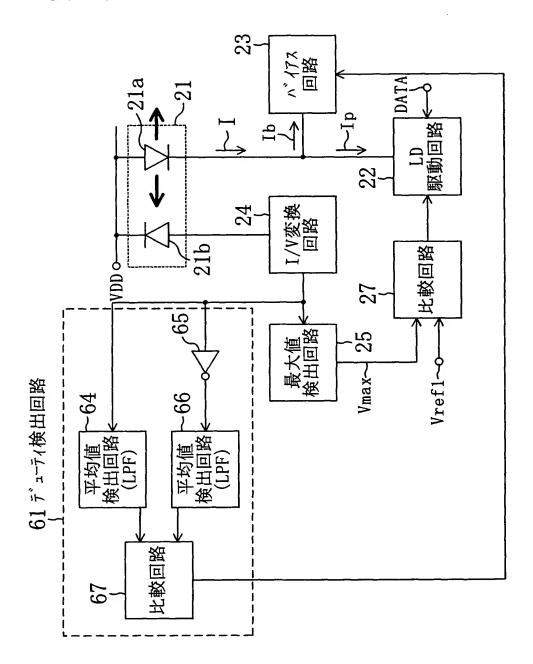
【図10】



【図11】



【図12】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 レーザダイオード (LD) の閾値電流及び変換効率に変動が生じた場合でも最大光出力、消光比及びデューティ比を常に一定に制御できるレーザ駆動回路を提供する。

【解決手段】 LDからなる発光回路21aと、該発光回路を駆動するためのLD駆動回路22と、該LD駆動回路から出力されるパルス電流にバイアス電流を付加するためのバイアス回路23と、発光回路の出力するモニタ光を受光するための受光回路21bと、該受光回路の出力を電流一電圧変換するためのI/V変換回路24と、該I/V変換回路の出力電圧の最大値及び平均値をそれぞれ検出するための最大値検出回路25及び平均値検出回路26と、検出した最大値と第1の基準値とを比較して結果をLD駆動回路へ帰還するための第1の比較回路27と、検出した平均値と第2の基準値とを比較して結果をバイアス回路へ帰還するための第2の比較回路29とを設ける。

【選択図】

図 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社